

AMP MCP* 6.3/4.8K Contact System

AMP MCP* 6.3/4.8K Kontaktsystem

Contents	Page	Inhaltsverzeichnis	Seite
1. SCOPE	2	1. ZWECK	2
1.1. Content	2	1.1 Inhalt	2
1.2. Qualification	2	1.2 Qualifikation	2
2. REFERENCED DOCUMENTS	2	2. ZUSÄTZLICHE UNTERLAGEN	2
2.1. TE-Connectivity documents	2	2.1 TE-Connectivity Unterlagen	2
2.2. General documents	2	2.2 Allgemeine Unterlagen	2
3. DESCRIPTION	3	3. BESCHREIBUNG	3
3.1. Contact design	3	3.1 Kontaktaufbau	3
3.2. Materials	4	3.2 Werkstoffe	4
4. REQUIREMENTS	5	4. ANFORDERUNGEN	5
4.1. General requirements	5	4.1 Allgemeine Anforderungen	5
4.2. Characteristic data	5	4.2 Kennwerte	5
4.3. Test requirements and procedures	6	4.3 Testanforderungen und -abläufe	6
4.4. Test sequence	12	4.4 Prüfreihenfolge	12
5. ATTACHEMENTS	13	5. ANLAGEN	13
5.1. Derating curves	13	5.1 Derating Kurven	13
5.2. Test defaults	24	5.2 Testvorgaben	24

1. SCOPE

1.1. Content

This specification covers the performance, test and quality requirements of AMP MCP 6.3/4.8K contact system.

1.2. Qualification

When tests are performed for the AMP MCP 6.3/4.8K contact system the following defined specifications and standards must be used. All inspections must be performed using the applicable inspection plan and product drawing.

2. REFERENCED DOCUMENTS

The following mentioned documents, if they are referred to, are part of this specification. In case of conflicts between the requirements of this specification and the referenced documents, this specification takes precedence. In case of discrepancies between both languages the German text is valid.

2.1. TE Connectivity documents

Customer drawing

C-1241438 page 1 AMP MCP 6.3/4.8K contact system

Application specification

114-18388 AMP MCP 6.3/4.8K contact system

2.2. General documents

DIN IEC60512 Electromechanical components for electronic equipment, basic testing procedures and methods in engagement.

DIN EN 60068 Environmental testing

DIN EN 60352 Solderless connections – Part 2: Crimped connections - General requirements, test methods and practical guidance

LV214 Motor vehicle connectors test specification 2010-03

1. ZWECK

1.1 Inhalt

Diese Spezifikation beschreibt die Eigenschaften, Test- und Qualitätsanforderungen des AMP MCP 6.3/4.8K Kontaktsystems.

1.2 Qualifikation

Bei der Prüfung des AMP MCP 6.3/4.8K Kontaktsystems sind die nachfolgend genannten Richtlinien und Normen zu verwenden. Alle Prüfungen müssen nach den zugehörigen Prüfplänen und Produktzeichnungen durchgeführt werden.

2. ZUSÄTZLICHE UNTERLAGEN

Die nachfolgend genannten Unterlagen, sofern darauf verwiesen wird, sind Teil dieser Spezifikation. Im Falle des Widerspruches zwischen dieser Spezifikation und den aufgeführten Unterlagen hat diese Spezifikation Vorrang. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den beiden Sprachen gilt der deutsche Text.

2.1 TE Connectivity Unterlagen

Kundenzeichnung

C-1241438 Seite 1 AMP MCP 6.3/4.8K Kontaktsystem

Verarbeitungsspezifikationen

114-18388 AMP MCP 6.3/4.8K Kontaktsystem

2.2 Allgemeine Unterlagen

DIN IEC60512 Elektrisch mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen, Meß- und Prüfverfahren

DIN EN 60068 Umweltprüfung

DIN EN 60352 Lötfreie Verbindungen Teil 2 Crimpverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise

LV214 KFZ-Steckverbinder Prüfvorschrift 2010-03

3. DESCRIPTION

3.1. Contact design

Design and dimensions of the AMP MCP 6.3/4.8K terminals conform to the drawings and are checked according to the TE Connectivity quality guidelines.

The AMP MCP 6.3/4.8K terminal is a flat terminal with four independent tongues and a stainless steel cantilever spring. The spring has two locking lances for first lock in the contact cavity. There are terminals available with insulation crimp seen on figure 1 as well as terminals with crimp for single-wire-seals seen on figure 2.

Suitable mating parts are tabs with the standard dimension 5.8 x 0.8 mm respectively tab headers between 4.8 x 0.8 mm and 6.3 x 0.8mm. They have to be according to specification 114-94201 "Contact pins and tabs for shrouded connection.

The cavity pitch for terminals with insulation crimp is 8 x 6mm.

If the cavities of the terminals with crimp for single-wire-seals will be moved about half of the pitch from one row to the other then it is possible to position the terminals in a pitch of 9 x 8mm. In case of parallel arrangement a pitch of min. 9 x 9mm is necessary.

3. BESCHREIBUNG

3.1 Kontaktaufbau

Design und Maße des AMP MCP 6.3/4.8K Kontakte entsprechen den Zeichnungen und werden nach den TE Connectivity Qualitätsrichtlinien überprüft.

Der AMP MCP 6.3/4.8K Kontakt ist ein Flachkontakt mit vier unabhängigen Kontaktfedern und einer Stahlüberfeder. An dieser Überfeder sind zwei Rastfedern angebracht, die zur Verrastung in der Kontaktkammer dienen. Es existieren Kontakte mit Isolationscrimp, wie in Bild 1 dargestellt, sowie auch Kontakte mit Crimp für Einzelleiterdichtungen, wie in Bild 2 dargestellt.

Als Gegenstecker dienen Flachstecker mit der Normgröße 5,8 x 0,8mm bzw. Messerleisten mit Flachstecker-Abmessungen zwischen 4,8 x 0,8mm und 6,3 x 0,8mm. Diese müssen den Anforderungen nach Spezifikation 114-94201 „Kontaktstifte und Messer für Kragenanschluss“ entsprechen.

Das Raster der Kammern für Kontakte mit Isolationscrimp beträgt 8 x 6mm.

Werden die Kammern der Kontakte mit Crimp für Einzelleiterdichtungen im Gehäuse von einer zur nächsten Reihe um das halbe Raster versetzt, ist es möglich diese in einem Raster von 9 x 8mm anzutragen. Bei paralleler Ausführung ist hingegen ein Raster von min. 9 x 9mm erforderlich.

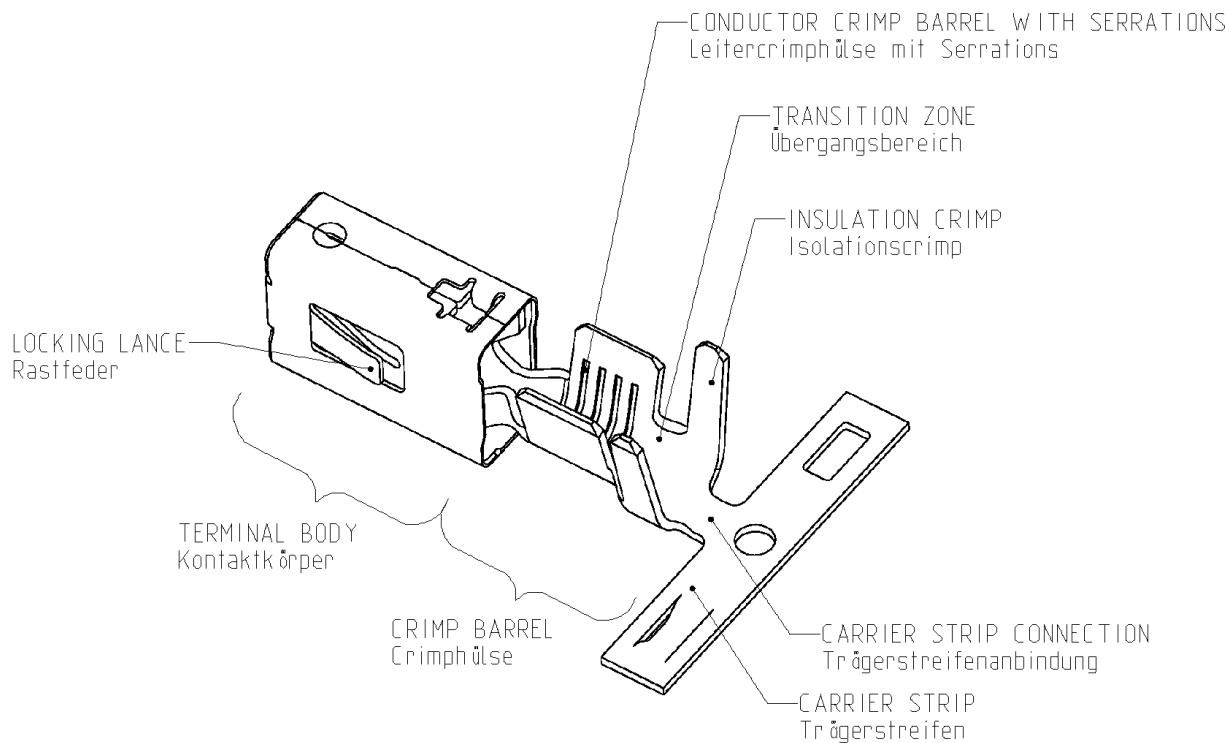


Figure 1: Terminals with insulation crimp /
Bild 1: Kontakte mit Isolationscrimp

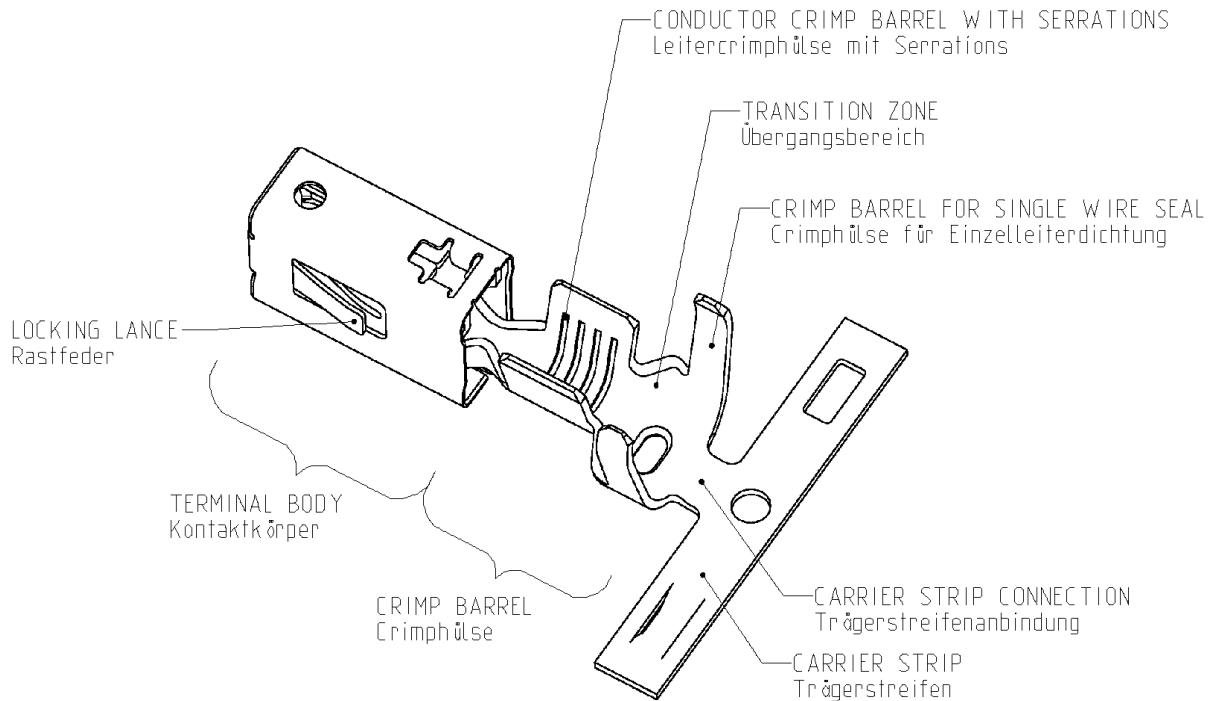


Figure 2: Terminals with crimp for single-wire-seals /
Bild 2: Kontakte mit Crimp für Einzelleiterdichtungen

3.2. Materials

Information about this can be found on customer drawing.

4. REQUIREMENTS

4.1. General requirements

The crimp quality has to be according to the TE specifications.

Specified TE applicators must be used.

Housings according to TE specifications must be used.

The terminals must comply with the current drawing.

For testing only serial parts must be used.

4.2. Characteristic data

Voltage:

Acc. to IEC 60 664 –1 (DIN VDE 0110)

Current carrying capability:

see derating curves,
Diagram 1-18

Temperature from: *)

- 40 bis 130°C (Sn variant)
- 40 bis 140°C (Ag variant)
- 40 bis 180°C (Ag+ variant)

*) Ambient temperature and heating up by current.
Limit temperature of wire and housing (where applicable single-wire-seal) must be
≥ limit temperature of application

3.2 Werkstoffe

Angaben hierzu sind der Kundenzeichnung zu entnehmen.

4. ANFORDERUNGEN

4.1 Allgemeine Anforderungen

Die Crimpqualität muss den TE-Spezifikationen entsprechen.

Es müssen die spezifizierten TE Crimpwerkzeuge verwendet werden.

Es müssen Gehäuse nach TE-Spezifikationen verwendet werden.

Die Kontakte müssen dem aktuellen Zeichnungsstand entsprechen.

Für Prüfzwecke sind nur Serienteile zu verwenden.

4.2 Kennwerte

Nennspannung:

Nach IEC 60 664 –1 (DIN VDE 0110)

Strombelastbarkeit:

siehe Deratingkurven,
Diagramm 1-18

Temperaturbereich von: *)

- 40 bis 130°C (Sn Varianten)
- 40 bis 140°C (Ag Varianten)
- 40 bis 180°C (Ag+ Varianten)

*) Umgebungstemperatur und Stromerwärmung.
Grenztemperatur der verwendeten Leitung und Gehäuse
(ggf. Einzelleiterdichtung) muss ≥ der Gesamtanwendung sein

4.3. Test requirements and procedure
4.3 Testanforderungen und -ablauf

Test description / Testbeschreibung	Test requirement / Testanforderung	Test procedure / Testablauf
Receiving inspection and testing / <i>Eingangsprüfung</i> Visual inspection / <i>Sichtprüfung</i> Contact resistance in contact area / <i>Durchgangswiderstand im Kontaktbereich</i>	 $R_K \leq 2\text{m}\Omega$	 DIN EN 60512-1-1 / LV214-E0.1 DIN EN 60512-2-1 / LV214-E0.2.1 Measuring points see Fig.3 <i>Messpunkte siehe Abb. 3</i>
Crimp resistance / <i>Crimpdurchgangswiderstand</i>	0,22mm ² : $R_{\text{crimp}} \leq 3,5\text{ m}\Omega$ 0,35mm ² : $R_{\text{crimp}} \leq 2,3\text{ m}\Omega$ 0,50mm ² : $R_{\text{crimp}} \leq 1,7\text{ m}\Omega$ 0,75mm ² : $R_{\text{crimp}} \leq 1,2\text{ m}\Omega$ 1,00mm ² : $R_{\text{crimp}} \leq 0,9\text{ m}\Omega$ 1,50mm ² : $R_{\text{crimp}} \leq 0,6\text{ m}\Omega$ 2,50mm ² : $R_{\text{crimp}} \leq 0,4\text{ m}\Omega$ 4,00mm ² : $R_{\text{crimp}} \leq 0,3\text{ m}\Omega$ 6,00mm ² : $R_{\text{crimp}} \leq 0,2\text{ m}\Omega$	DIN EN 60512-2-1 Measuring points see Fig.3 <i>Messpunkte siehe Abb. 3</i>
Contact overlap / <i>Kontaktüberdeckung</i>	$\geq 1,0\text{mm}$	theoretical proof / <i>theoretischer Nachweis</i>
Mechanical and thermal relaxation behavior / <i>Mechanisches und thermisches Relaxationsverhalten</i> Visual inspection / <i>Sichtprüfung</i> Contact normal force / <i>Kontaktnormalkraft</i> Unused / <i>Neuzustand</i>	 $\text{min. } 4\text{ N} - \text{max. } 10\text{ N}$	 DIN EN 60512-1-1 / LV214-E0.1
Aging in dry heat / <i>Lagerung bei trockener Wärme</i>	$\text{min. } 2\text{ N} - \text{max. } 8\text{ N}$	DIN EN 60068-2-2 / LV214-B5.3
Contact retention force out of cavity / <i>Kontaktausreißkraft aus der Kammer</i>	min. 80N (check distance / <i>Prüfweg</i> $\leq 1\text{mm}$)	LV214-E8.2

Test description / Testbeschreibung	Test requirement / Testanforderung	Test procedure / Testablauf
Conductor pull out strength / Leiterausreiβkraft aus dem Crimp Visual inspection / Sichtprüfung Conductor pull out strength (insulation crimp inactive)/ <i>Leiterausreiβkraft aus dem Crimp</i> <i>(Isolationscrimp unwirksam)</i>	0,22mm ² : ≥ 32N 0,35mm ² : ≥ 50N 0,50mm ² : ≥ 60N 0,75mm ² : ≥ 85N 1,00mm ² : ≥ 140N 1,50mm ² : ≥ 150N 2,50mm ² : ≥ 200N 4,00mm ² : ≥ 310N 6,00mm ² : ≥ 450N	DIN EN 60512-1-1 / LV214-E0.1 LV214-E10.1
Insertion and removal forces, mating cycle frequency / Steck- und Ziehkräfte, Steckhäufigkeit Visual inspection / Sichtprüfung Mating and unmating forces / Steck- und Ziehkräfte	Mating / Stecken: 7 – 12 N Unmating / Ziehen: 2 – 11 N With reference tab / mit Prüf-Flachstecker	DIN EN 60512-1-1 / LV214-E0.1 LV214-E11.1 With reference tab / mit Prüf-Flachstecker PN 1-0965850-1
Mating cycles / Steckzyklen	Sn ≤ 10 ¹) Ag ≤ 50 ¹) Ag+ ≤ 50 ¹) mating force variation > 25% acceptable Steckkraftveränderung > 25% zulässig	LV214-B11.1
1) The maximum number of mating cycles is dependent on the tribological properties of the used surfaces in each case. Only by using the relevant / matching surfaces and contact geometries, receptacle and tab contacts produced and delivered by TE Connectivity, the maximum number of insertions can be achieved. / 1) Die zulässige Anzahl der Steckzyklen ist abhängig von den tribologischen Eigenschaften der jeweils verwendeten Oberfläche. Nur bei Verwendung der von TE Connectivity produzierten und gelieferten Oberflächen und Kontaktgeometrien, Buchsen- und Stiftseitig, kann die zulässige Steckzyklenanzahl erreicht werden.		
Current temperature rise, derating (without housing) / Stromerwärmung, Derating (ohne Gehäuse)	See derating curve, diagram 1 – 18 / siehe Derating Kurve, Diagramm 1 - 18	DIN EN 60512-5-2 / LV214-E12.2

Test description / Testbeschreibung	Test requirement / Testanforderung	Test procedure / Testablauf
Thermal time constant / Thermische Zeitkonstante	See diagram 19 – 21 / Siehe Diagramm 19 - 21	LV214-E14.1
Electrical stress test / Elektrischer Stresstest		
Visual inspection / <i>Sichtprüfung</i>		DIN EN 60512-1-1 / LV214-E0.1
Contact resistance / <i>Durchgangswiderstand</i>	LV214 appendix D / LV214 Anhang D	DIN EN 60512-2-1 / LV214-E0.2 Measuring points see Fig.3 <i>Messpunkte siehe Abb. 3</i>
Derating (without housing) / <i>Derating (ohne Gehäuse)</i>	$\Delta I \leq 0.2 \times I_{ini}$ at 80°C after test / bei 80°C nach Test	DIN EN 60512-5-2 / LV214-E12.2
Temperature cycle endurance test, current cycle endurance test / <i>Temperatur-Stromwechsel-Dauertest</i>		LV214-B15.2
Humid heat, cyclic (variant 1)/ <i>Feuchte Wärme, zyklisch (Variante 1)</i>		DIN EN 60068-2-30 / LV214-B15.3
Dynamic stress / Dynamische Beanspruchung		
Visual inspection / <i>Sichtprüfung</i>		DIN EN 60512-1-1 / LV214-E0.1
Contact resistance / <i>Durchgangswiderstand</i>	LV214 appendix D / LV214 Anhang D	DIN EN 60512-2-1 / LV214-E0.2 Measuring points see Fig.3 <i>Messpunkte siehe Abb. 3</i>
Dynamic load, broad-band random vibration / <i>Dynamische Beanspruchung, Breitbandrauschen</i>	The dynamic stress severity depends on operational area and the housing used; the verification has to be done for each housing and each site of operation separately / <i>Der Schärfegrad ist abhängig von dem Einsatzbereich und dem verwendeten Gehäuse; die Prüfung ist jeweils für die eingesetzten Gehäuse und den Einsatzort speziell durchzuführen</i>	DIN EN 60068-2-64 / LV214-B17.2 DIN EN 60064-2-27 / LV214-B17.3
Endurance shock test / <i>Dauerschicken</i>		DIN EN 60068-2-27 / LV124-M05
Mechanical shock test / <i>Mechanischer Schock</i>		

Test description / <i>Testbeschreibung</i>	Test requirement / <i>Testanforderung</i>	Test procedure / <i>Testablauf</i>
Coastal climate load / <i>Küstenklimbeanspruchung</i>		
Visual inspection / <i>Sichtprüfung</i>		DIN EN 60512-1-1 / LV214-E0.1
Contact resistance / <i>Durchgangswiderstand</i>	LV214 appendix D / LV214 Anhang D	DIN EN 60512-2-1 / LV214-E0.2 Measuring points see Fig.3 <i>Messpunkte siehe Abb. 3</i>
Salt spray, cyclic / <i>Salznebel, zyklisch</i>		DIN EN 60068-2-52 / LV214-B18.2
Environmental simulation / <i>Umweltsimulation</i>		
Visual inspection / <i>Sichtprüfung</i>		DIN EN 60512-1-1 / LV214-E0.1
Contact resistance / <i>Durchgangswiderstand</i>	LV214 appendix D / LV214 Anhang D	DIN EN 60512-2-1 / LV214-E0.2 Measuring points see Fig.3 <i>Messpunkte siehe Abb. 3</i>
Temperature shock / <i>Temperaturschock</i>		DIN EN 60068-2-14 Na / LV214-B19.1
Temperature cycle / <i>Temperaturwechsel</i>		DIN EN 60068-2-14 / LV214-B19.2
Aging in dry heat / <i>Lagerung bei trockener Wärme</i>		DIN EN 60068-2-2 Test B / LV214-B19.3
Industrial climate (multiple-component climate) / <i>Industrie klima</i> <i>(Mehrkomponentenklima)</i>		DIN EN 60512-11-14 / LV214-B19.4
Humid heat, cyclic (variant 2) / <i>Feuchte Wärme, zyklisch</i> <i>(Variante 2)</i>		DIN EN 60068-2-30 / LV214-B19.5
Longterm temperature duration test / <i>Langzeittemperatlagerung</i>		
Visual inspection / <i>Sichtprüfung</i>		DIN EN 60512-1-1 / LV214-E0.1
Contact resistance / <i>Durchgangswiderstand</i>	LV214 appendix D / LV214 Anhang D	DIN EN 60512-2-1 / LV214-E0.2 Measuring points see Fig.3 <i>Messpunkte siehe Abb. 3</i>
Aging in dry heat / <i>Lagerung bei trockener Wärme</i>		DIN EN 60068-2-2 Test B / LV214-B21.1

4.4. Test sequence

The qualification inspection must be performed in the order as specified in the following table.

4.4 Prüfreihenfolge

Die Prüfungen müssen gemäß der in folgender Tabelle aufgeführten Prüfreihenfolge durchgeführt werden.

	Receiving inspection and testing / Eingangsprüfung	Mechanical and thermal relaxation behavior / Mechanisches und thermisches Relaxationsverhalten	Contact retention force / Kontaktausreißkraft	Conductor pull-out strength / Leiterausreißkraft aus dem Crimp	Insertion and removal forces, mating cycle frequency / Steck- und Ziehkräfte, Steckhäufigkeit	Current temperature rise, derating (without housing) / Stromwärmung, Derating (ohne Gehäuse)	Thermal time constant / Thermische Zeitkonstante
Visual inspection / <i>Sichtprüfung</i>	1	1, 5	1, 3	1, 3	1, 3	1, 3	1, 3
Contact resistance / <i>Durchgangswiderstand</i>	2						
Contact normal force / <i>Kontaktnormalkraft</i>		2, 4					
Contact retention force / <i>Kontaktausreißkraft</i>			2				
Conductor pull-out strength / <i>Leiterausreißkraft aus dem Crimp</i>				2			
Cross section / <i>Schliffbild</i>							
Insertion and removal forces, mating cycle frequency / <i>Steck- und Ziehkräfte, Steckhäufigkeit</i>					2		
Derating / <i>Derating</i>						2	
Aging in dry heat / <i>Lagerung bei trockener Wärme</i>		3					
Thermal time constant / <i>Thermische Zeitkonstante</i>							2

	Electrical stress test / Elektrischer Stresstest	Dynamic stress / Dynamische Beanspruchung	Coastal climate load / Küstenklimabean spruchung	Environmental simulation / Umweltsimulation	Longterm temp. duration test / Langzeittemperatur/lagerung
Visual inspection / <i>Sichtprüfung</i>	1, 9	1, 4, 7	1, 5	1, 6, 9	1, 5
Contact resistance / <i>Durchgangswiderstand</i>	2, 7,	2, 6	2, 4	2	2, 4
Derating / <i>Derating</i>	3, 8				
Contact resistance continuous (testing current) / <i>Durchgangswiderstand kontinuierlich (Prüfstrom)</i>	4, 5, 6	3		3, 4, 5, 8	
Temperature cycle endurance test, current cycle endurance test / <i>Temperatur-Stromwechsel-Dauertest</i>	4, 6				
Humid heat, cyclic (variant 1) / <i>Feuchte Wärme, zyklisch (Variante 1)</i>	5				
Dynamic load, broad band random vibration / <i>Dynam. Beanspruchung, Breitbandrauschen</i>		3			
Mechanical shock test / <i>Mechanischer Schock</i>		5			
Salt spray, cyclic <i>Salznebel, zyklisch</i>			3		
Temperature shock <i>Temperaturschock</i>				3	
Temperature cycling <i>Temperaturwechsel</i>				4	
Aging in dry heat / <i>Lagerung bei trockener Wärme</i>				5	3
Industrial climate (multiple-component climate) <i>Industrieklima (Mehrkomponentenklima)</i>				7	
Humid heat, cyclic (variant 2) <i>Feuchte Wärme, zyklisch (Variante 2)</i>				8	

5. ATTACHEMENTS

5.1. Derating curves

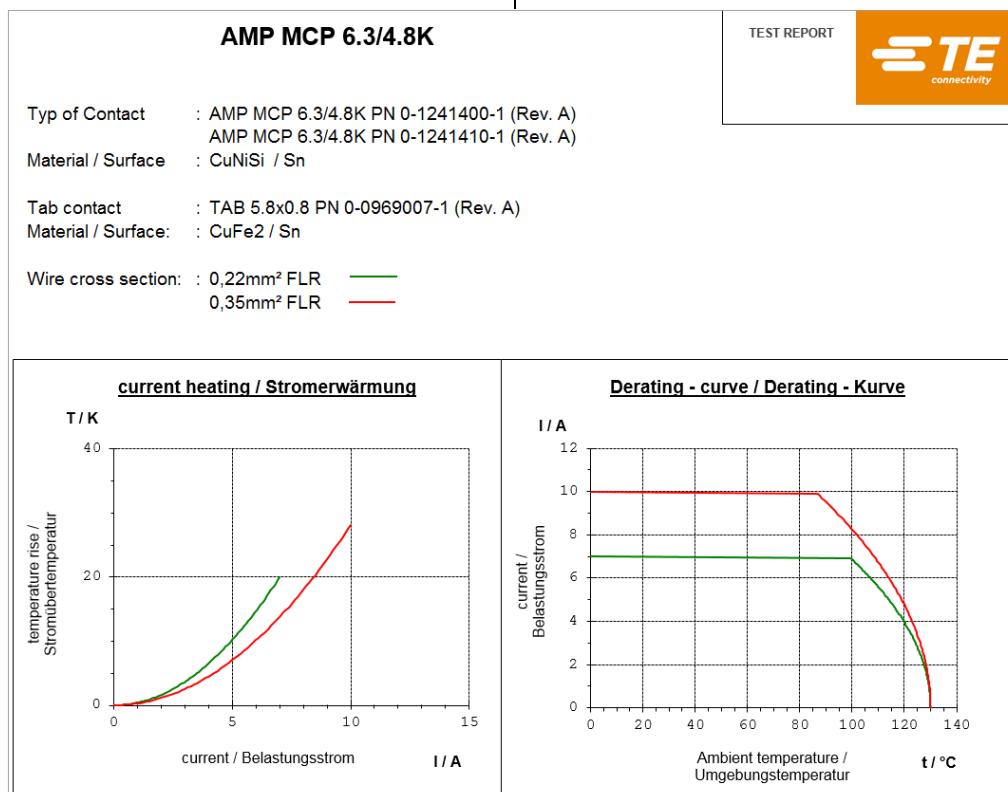


Diagram 1 / Diagramm 1

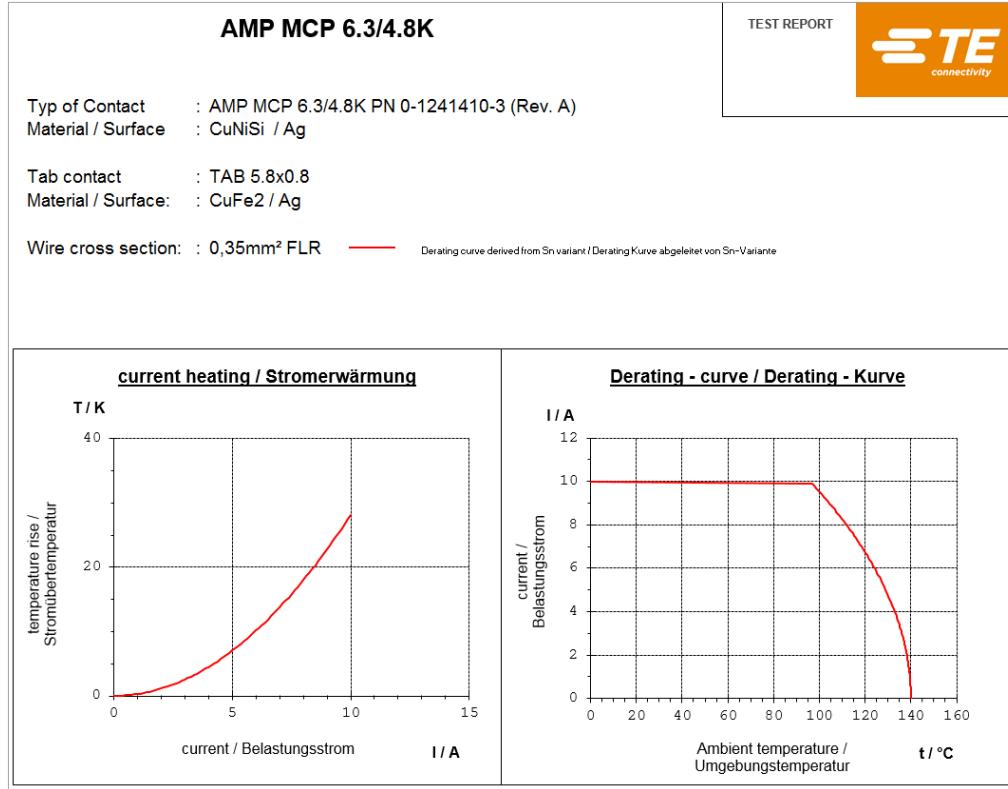


Diagram 2 / Diagramm 2

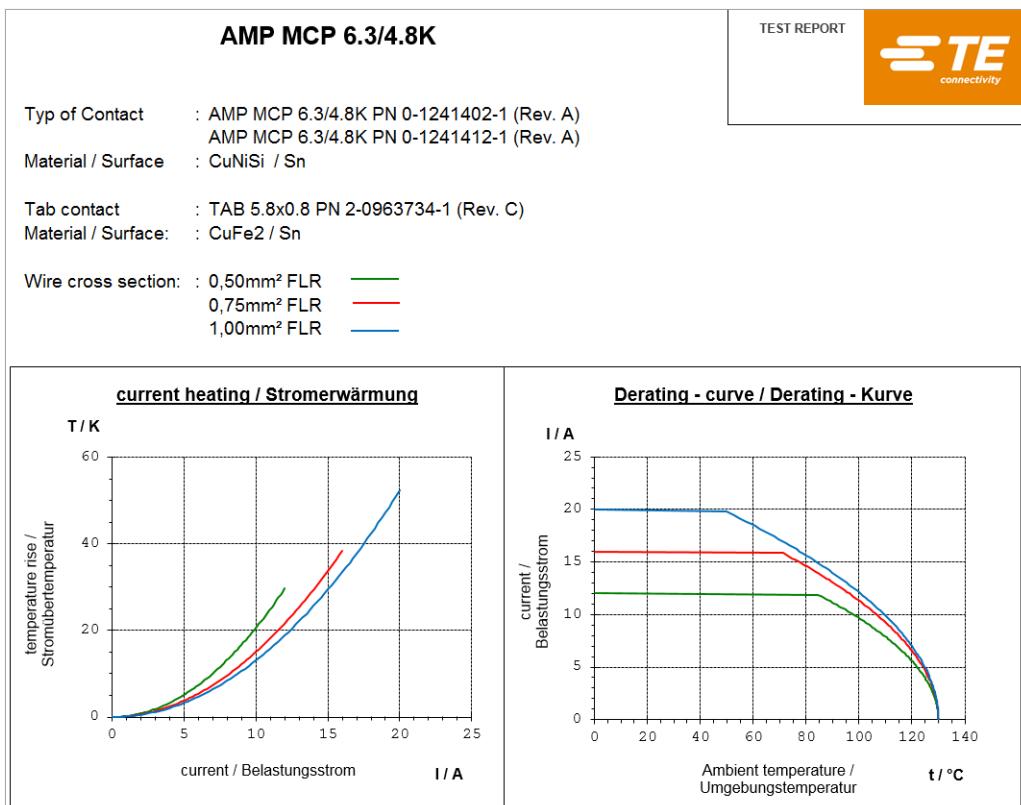


Diagram 3 / Diagramm 3

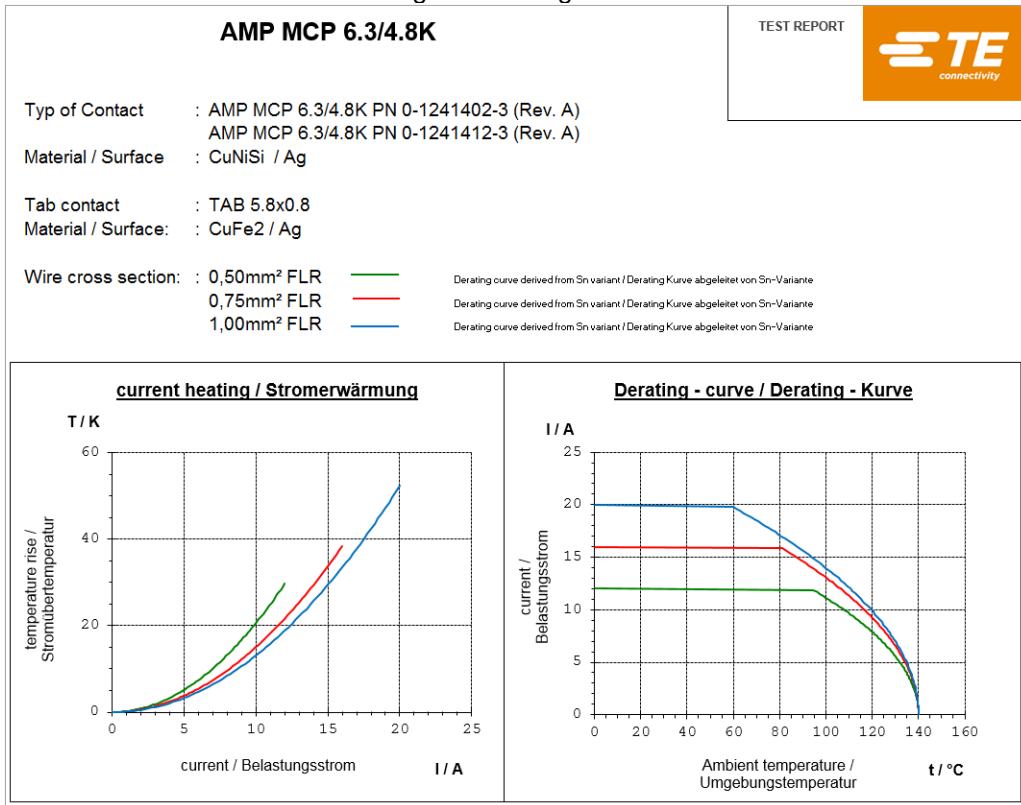


Diagram 4 / Diagramm 4

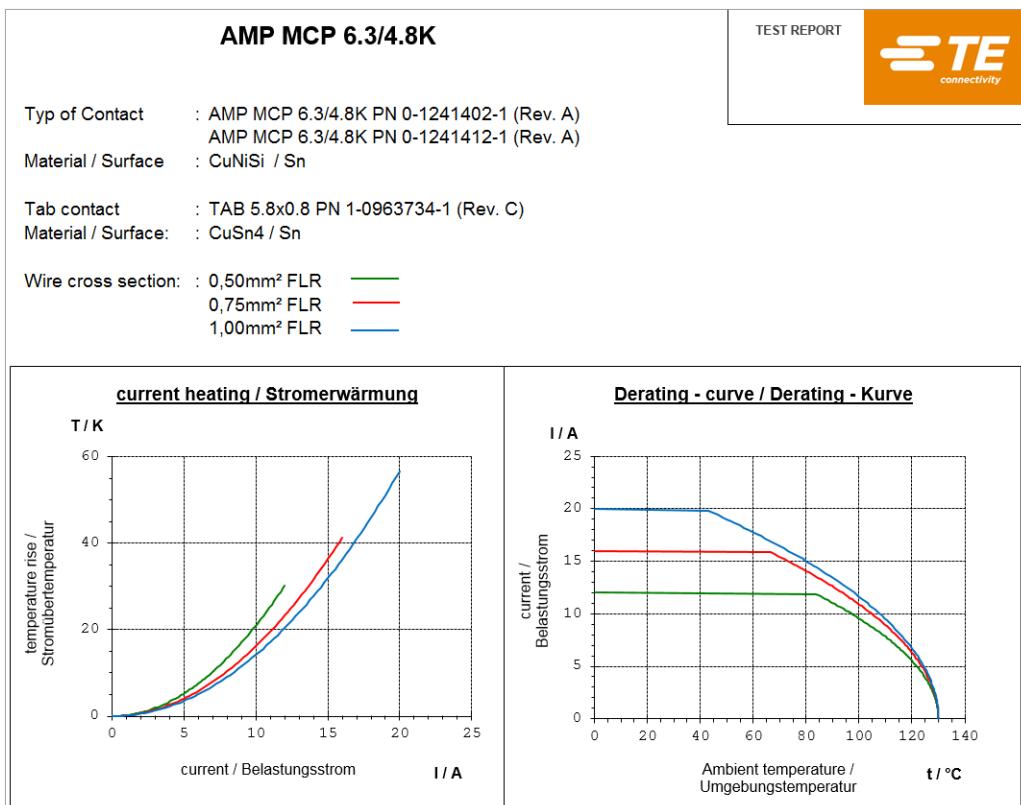


Diagram 5 / Diagramm 5

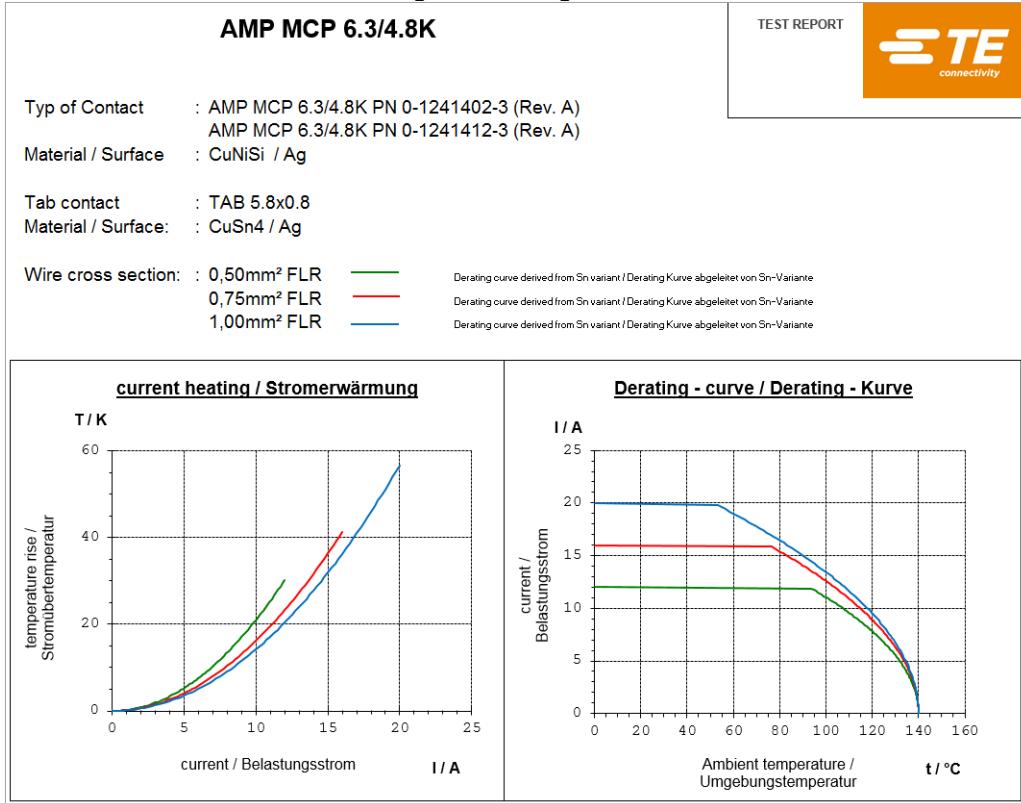


Diagram 6 / Diagramm 6

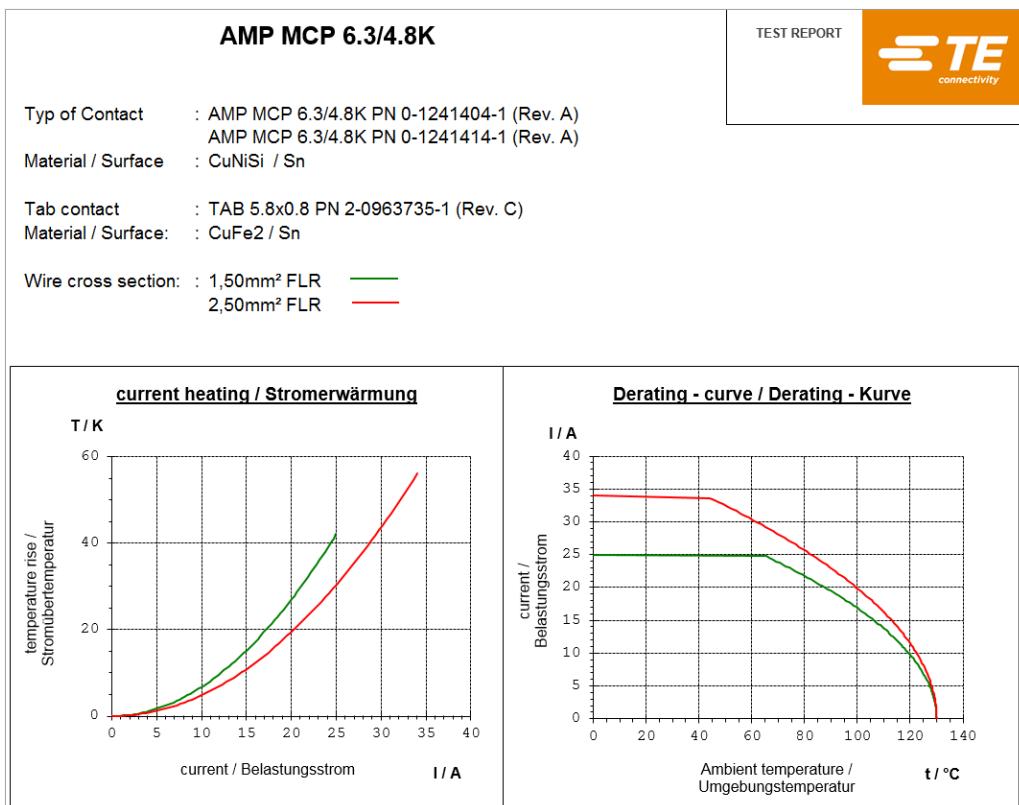


Diagram 7 / Diagramm 7

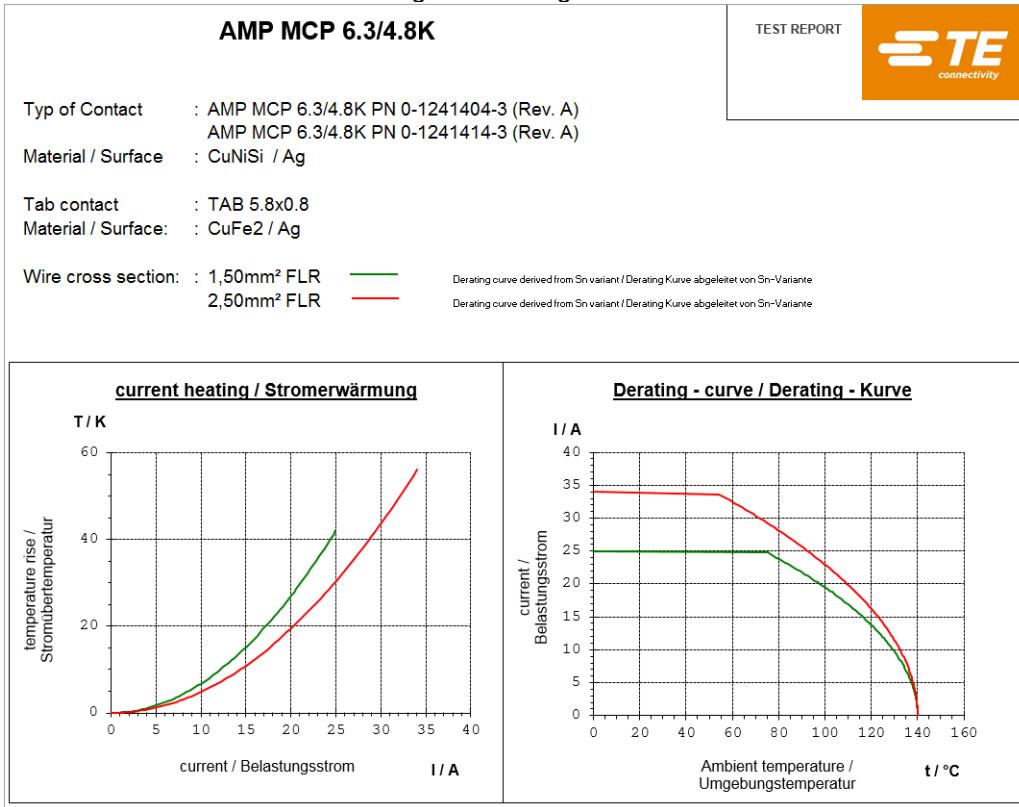


Diagram 8 / Diagramm 8

AMP MCP 6.3/4.8K

TEST REPORT

Typ of Contact : AMP MCP 6.3/4.8K PN 0-1241404-1 (Rev. A)
AMP MCP 6.3/4.8K PN 0-1241414-1 (Rev. A)

Material / Surface : CuNiSi / Sn

Tab contact : TAB 5.8x0.8 PN 1-0963735-1 (Rev. B)

Material / Surface: : CuSn4 / Sn

Wire cross section: : 1,50mm² FLR 
2,50mm² FLR 

<u>current heating / Stromerwärmung</u>		<u>Derating - curve / Derating - Kurve</u>	
T / K	current / Belastungsstrom	I / A	Ambient temperature / Umgebungstemperatur
80		40	140
60		35	120
40		30	100
20		25	80
0	0	0	0

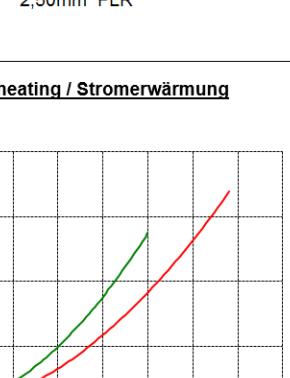
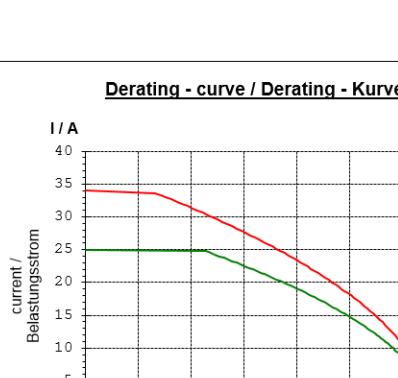



Diagram 9 / Diagramm 9

AMP MCP 6.3/4.8K

TEST REPORT

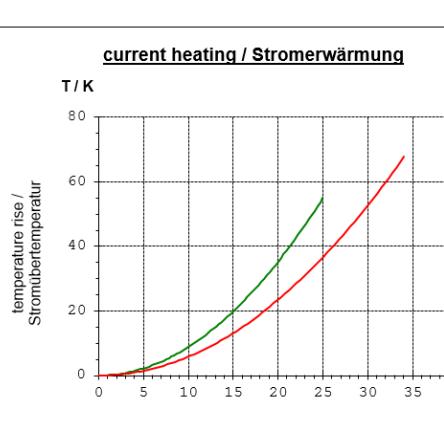
TE connectivity

Typ of Contact	: AMP MCP 6.3/4.8K PN 0-1241404-3 (Rev. A)
	AMP MCP 6.3/4.8K PN 0-1241414-3 (Rev. A)
Material / Surface	: CuNiSi / Ag
Tab contact	: TAB 5.8x0.8
Material / Surface:	: CuSn4 / Ag
Wire cross section:	: 1,50mm ² FLR  : 2,50mm ² FLR 

Derating curve derived from Sn variant / Derating Kurve abgeleitet von Sn-Variante

Derating curve derived from Sn variant / Derating Kurve abgeleitet von Sn-Variante

current heating / Stromerwärmung



T / K

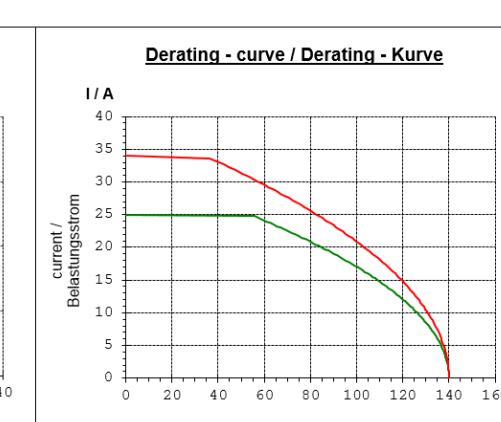
temperature rise / Stromübertemperatur

current / Belastungsstrom

I / A

current / I / A	temp rise / T / K (1.50mm ²)	temp rise / T / K (2.50mm ²)
0	0	0
5	5	2
10	10	5
15	15	8
20	20	12
25	25	16
30	30	20
35	35	25

Derating - curve / Derating - Kurve



I / A

current / Belastungsstrom

Ambient temperature / Umgebungstemperatur

t / °C

Ambient temperature / t / °C	current / I / A (1.50mm ²)	current / I / A (2.50mm ²)
0	35	25
20	34	25
40	32	24
60	28	21
80	22	17
100	15	12
120	8	8
140	0	0

Diagram 10 / Diagramm 10

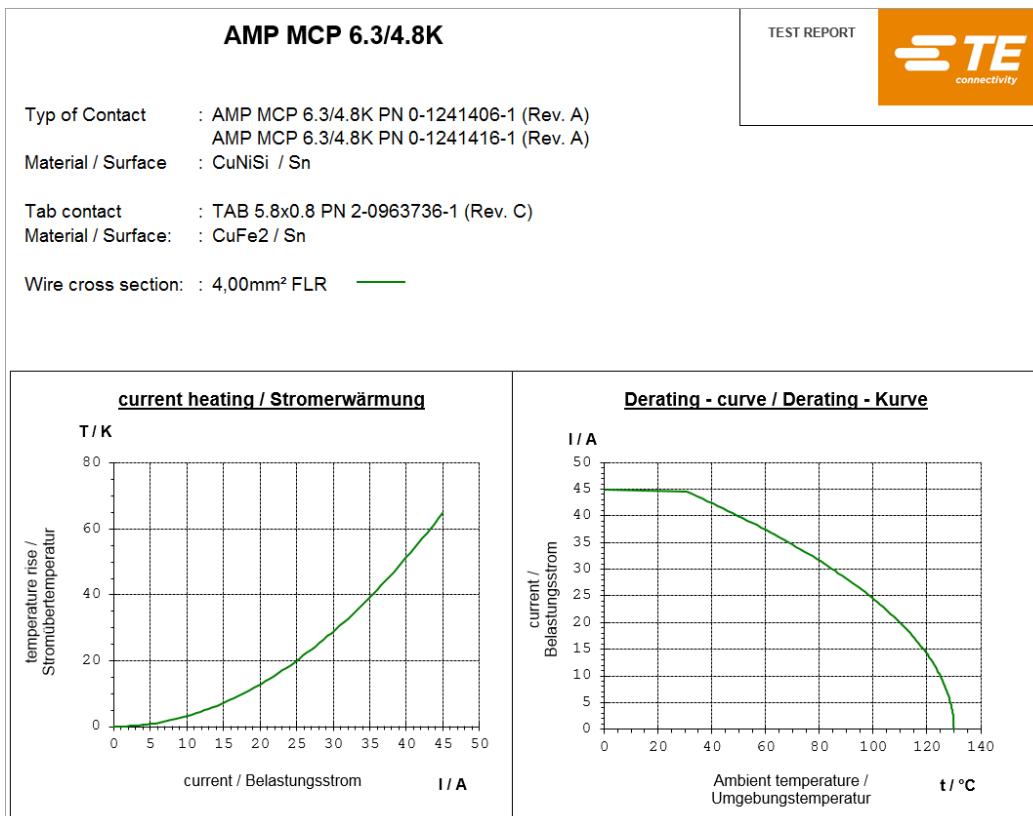


Diagram 11 / Diagramm 11

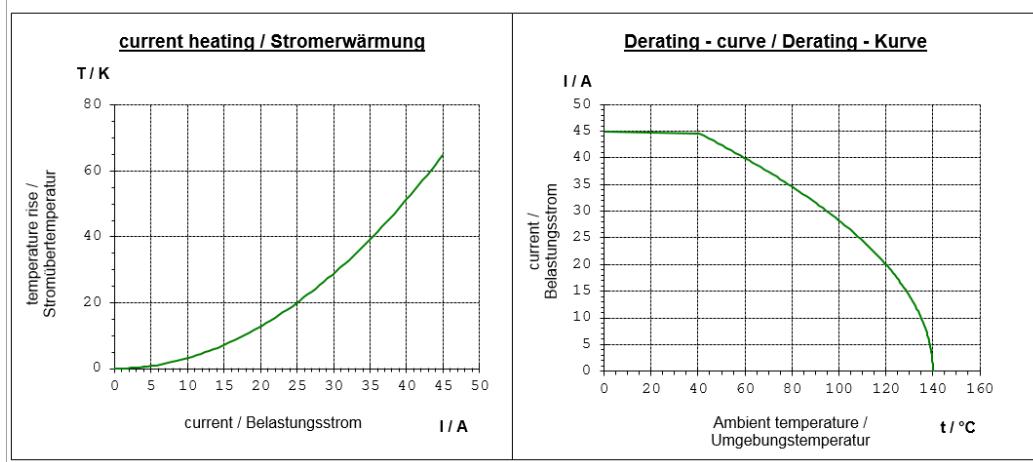
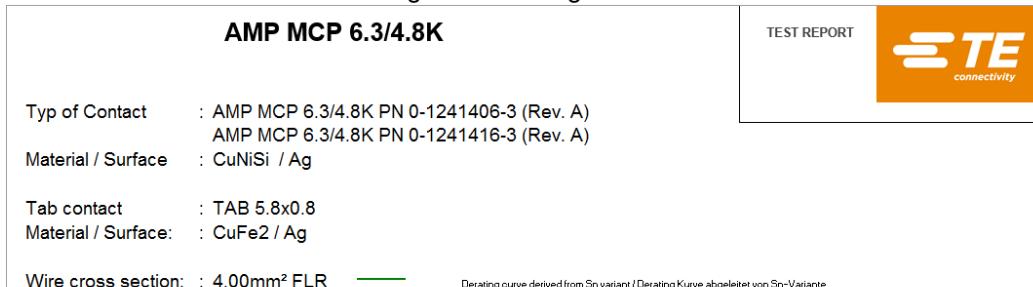


Diagram 12 / Diagramm 12

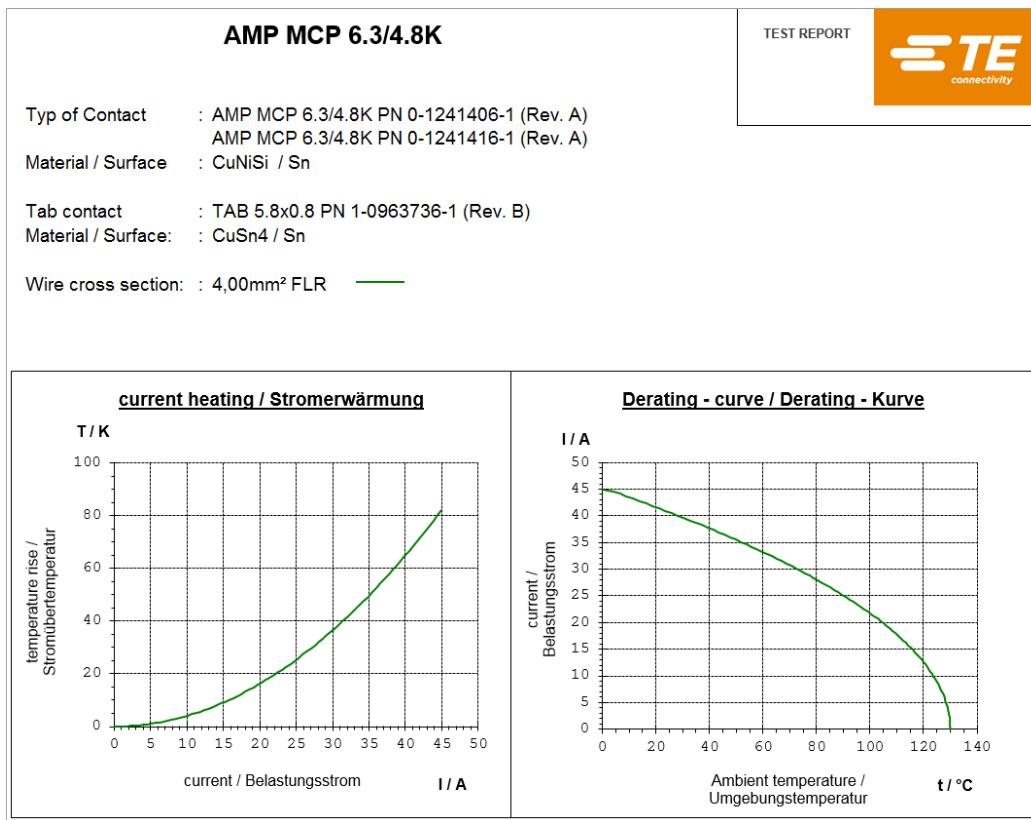


Diagram 13 / Diagramm 13

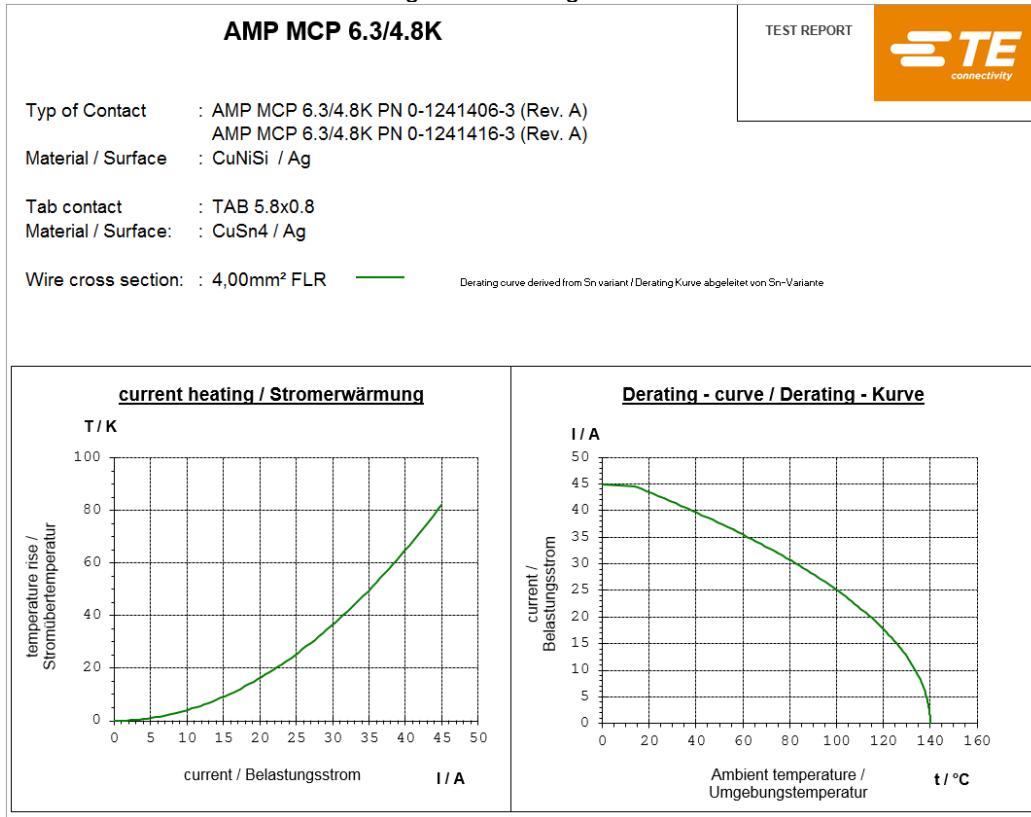


Diagram 14 / Diagramm 14

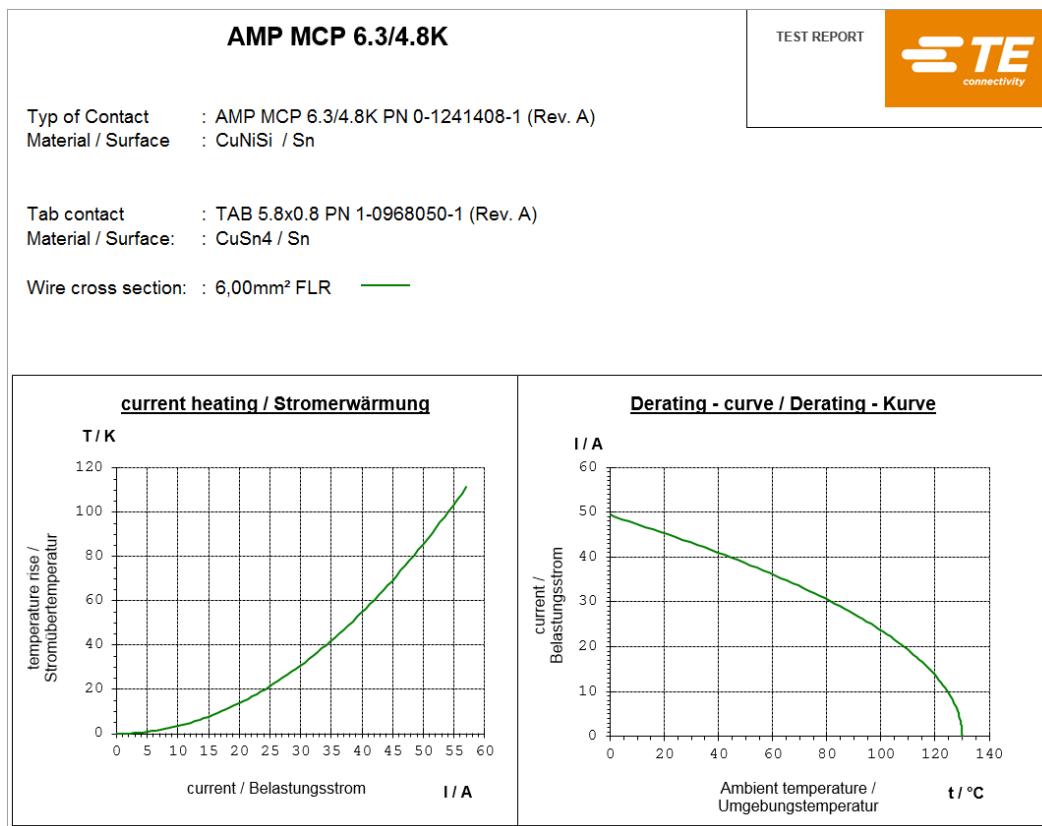


Diagram 15 / Diagramm 15

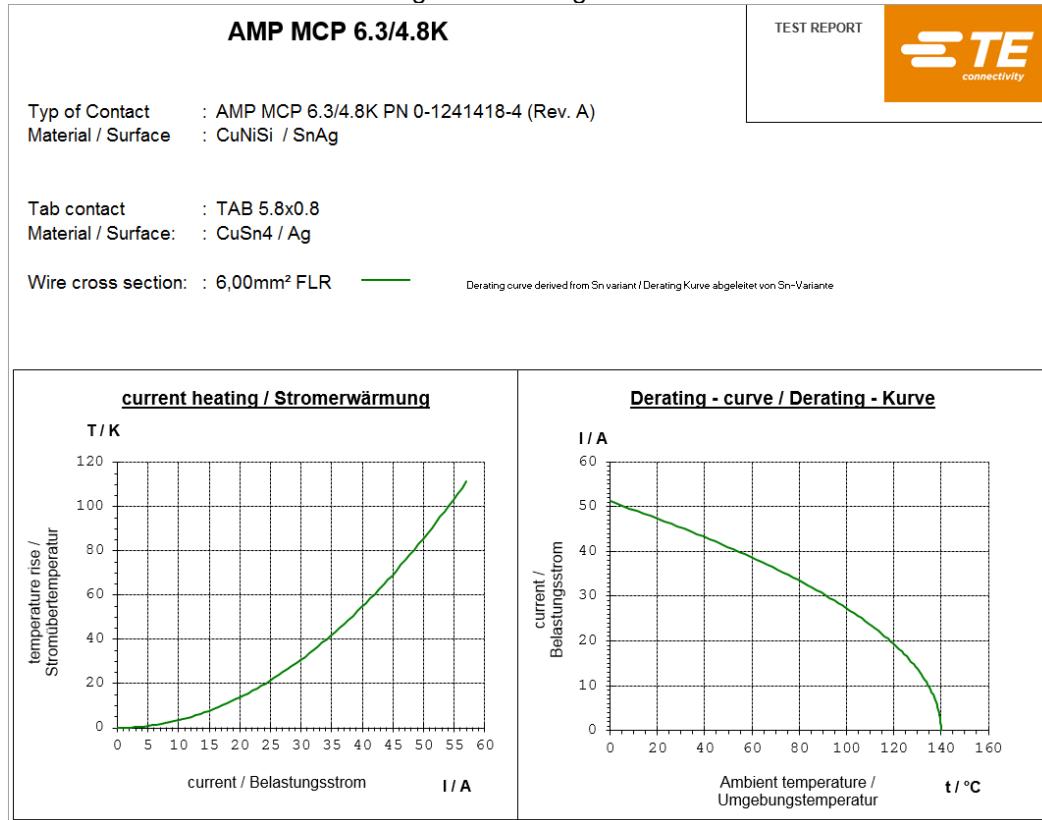
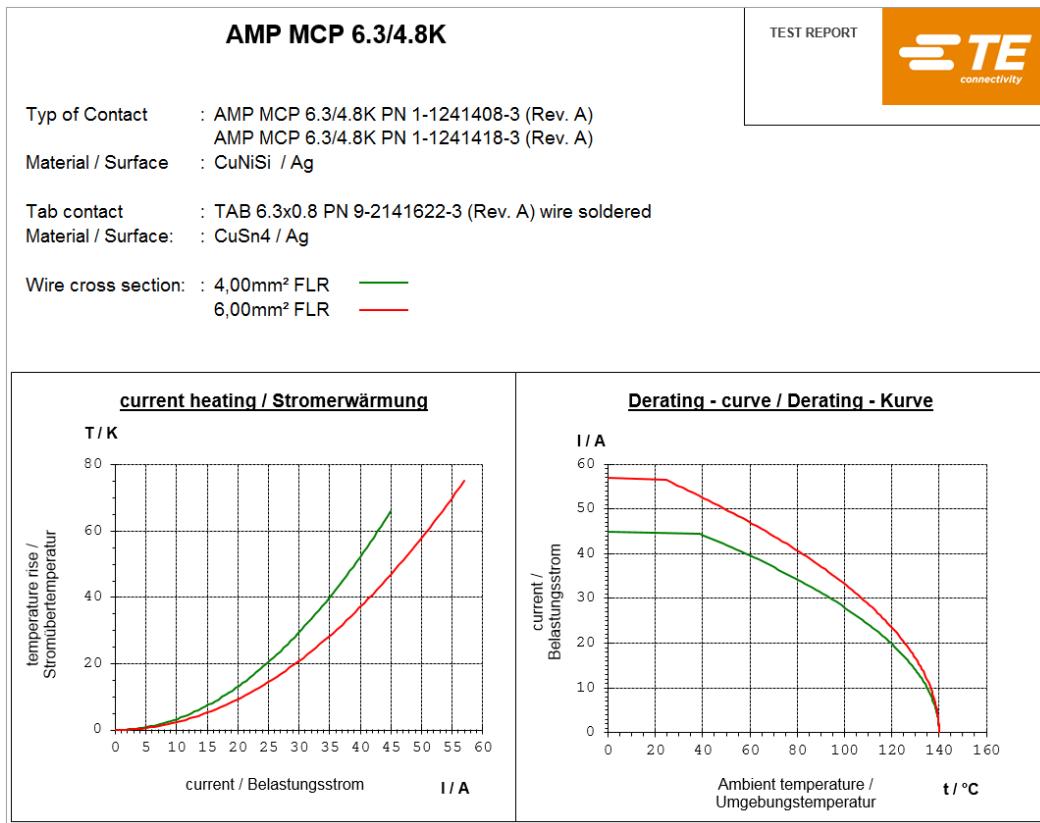
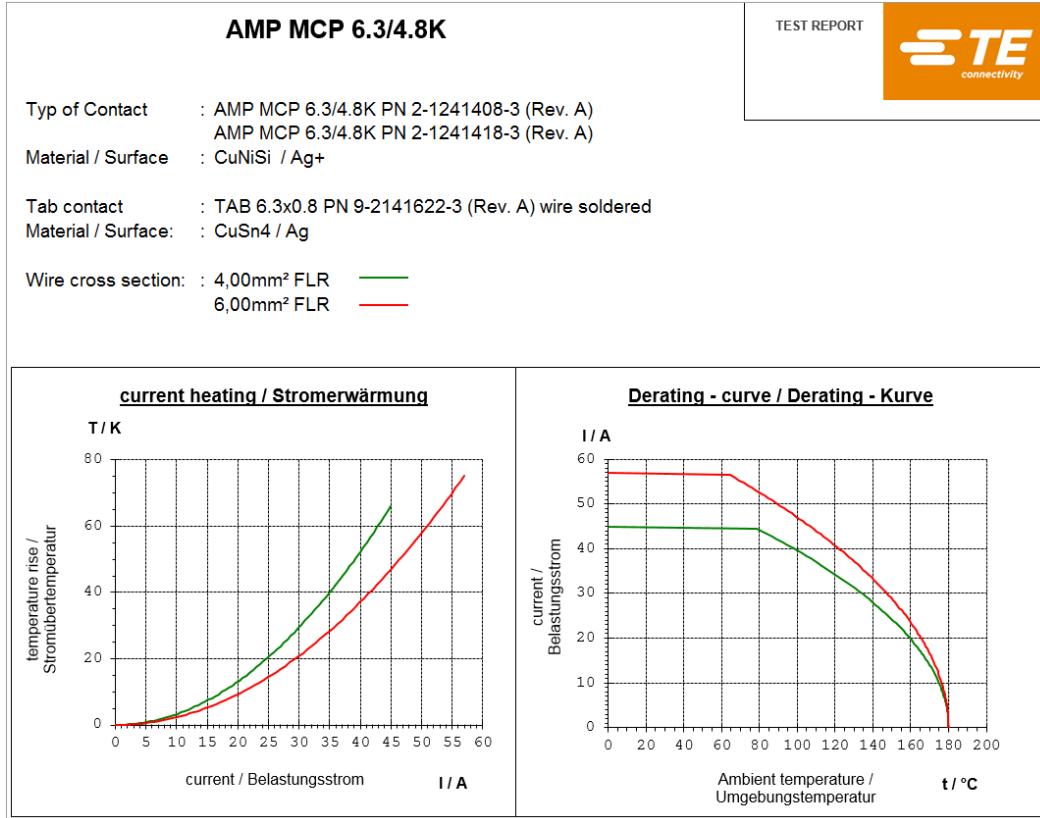


Diagram 16 / Diagramm 16


Diagram 17 / Diagramm 17

Diagram 18 / Diagramm 18

AMP MCP6.3/4.8K: 0-1241406-1 Rev.A
 Material: CuNiSi / Sn
 Leiter: 4mm² / FLR



Testaufbau : 3 Kontakte frei in Luft

TAB 5.8 x 0.8:
 Material: CuSn4 / Sn
 Leiter: 4mm² / FLR

1-0963736-1 Rev.B
 Material: CuSn4 / Sn
 Leiter: 4mm² / FLR

Abb. 6.1: Testmuster

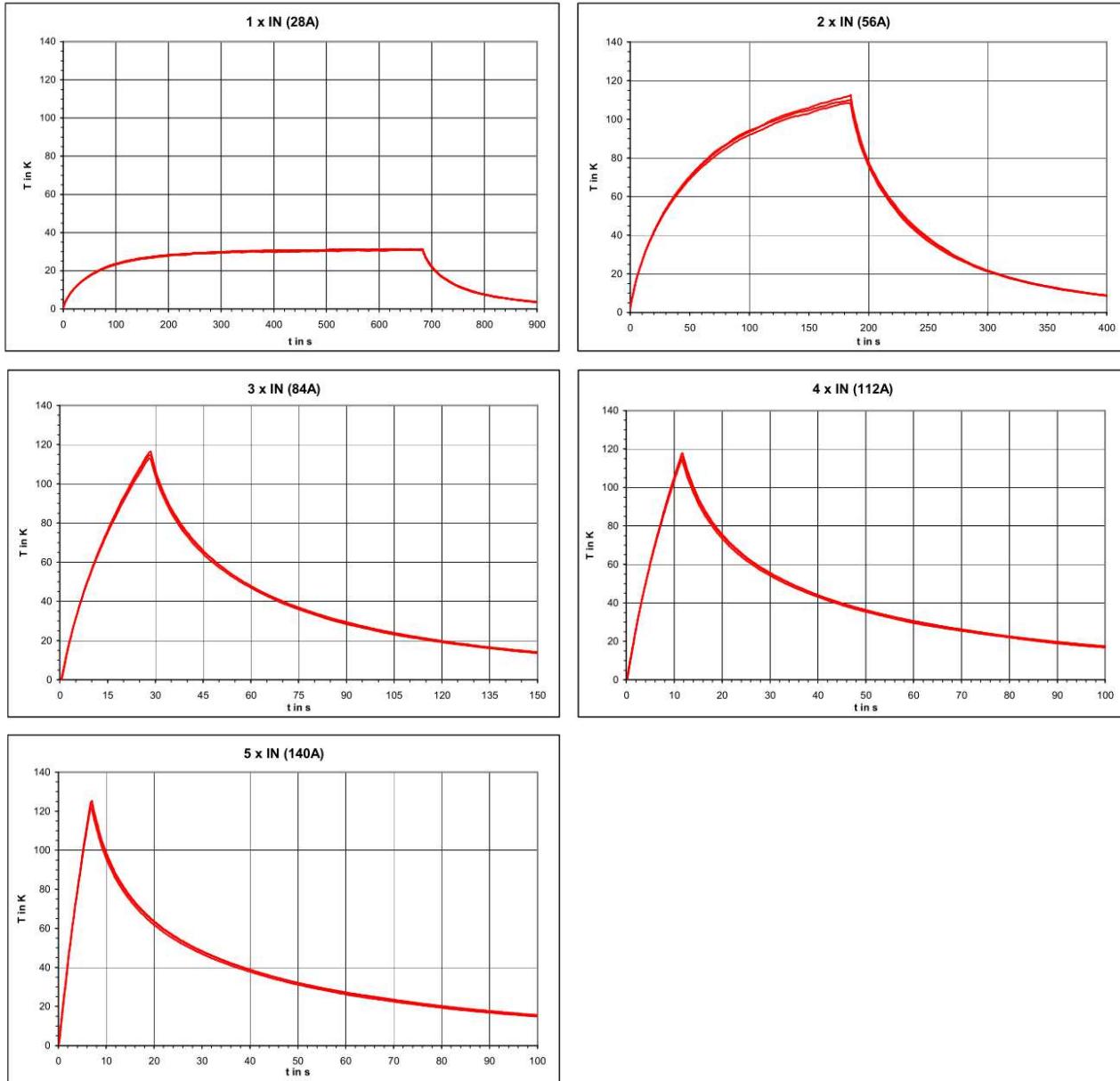


Diagram 19 / Diagramm 19

AMP MCP6.3/4.8K: 0-1241406-1 Rev.A
 Material: CuNiSi / Sn
 Leiter: 4mm² / FLR

Testaufbau : 3 Kontakte frei in Luft



TAB 5.8 x 0.8:
 Material: CuFe2 / Sn
 Leiter: 4mm² / FLR

Abb. 9.1: Testmuster

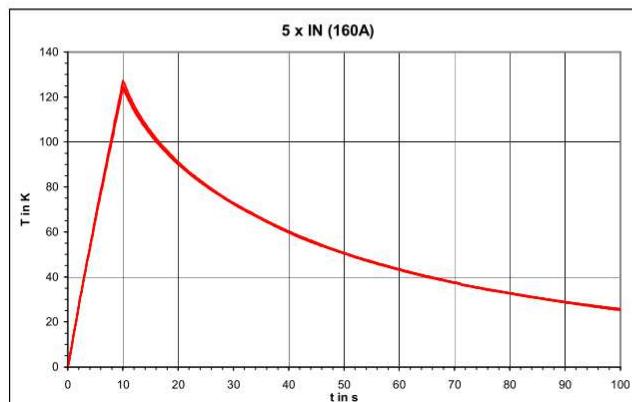
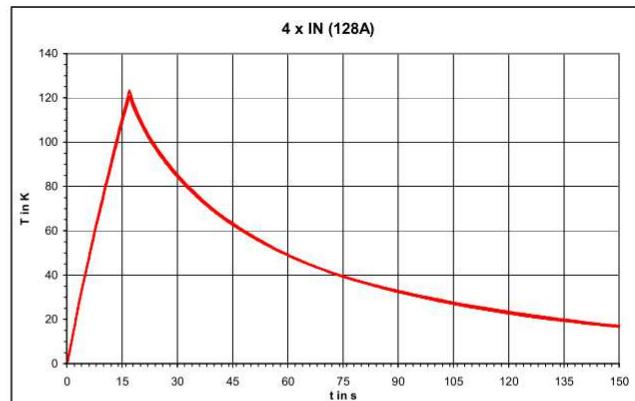
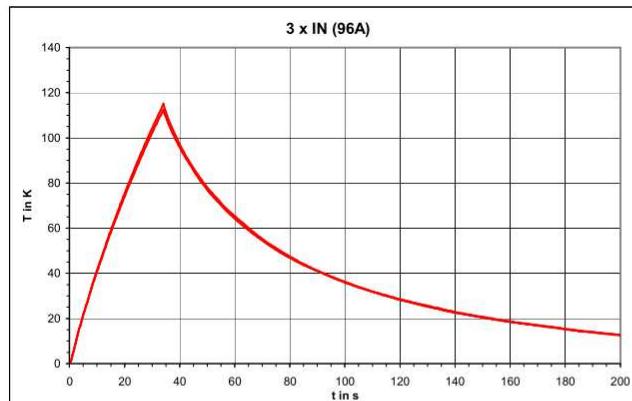
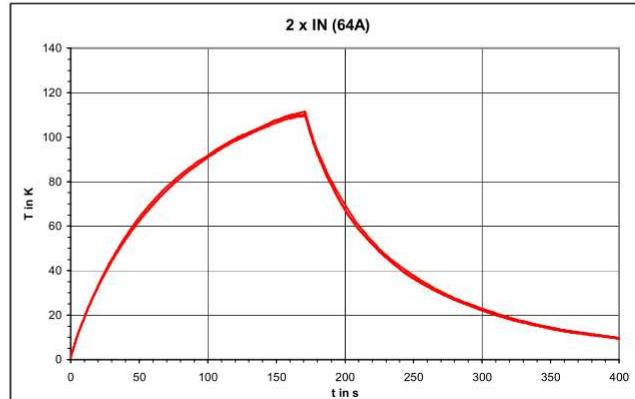
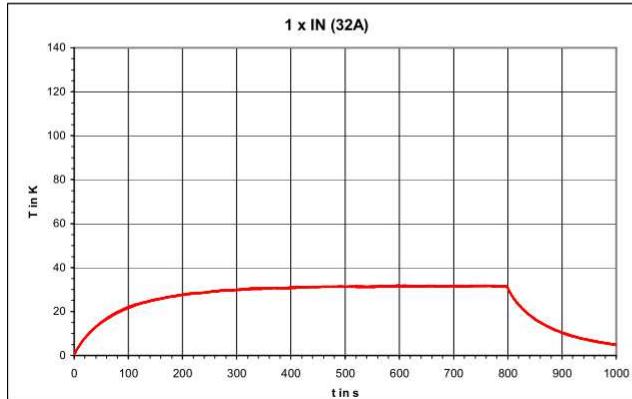


Diagram 20 / Diagramm 20

AMP MCP6.3/4.8K: 0-1241408-1 Rev.A
 Material: CuNiSi / Sn
 Leiter: 6mm² / FLR

Testaufbau : 3 Kontakte frei in Luft



TAB 5.8 x 0.8:
 Material: CuSn4 / Sn
 Leiter: 6mm² / FLR

Abb. 5.1: Testmuster

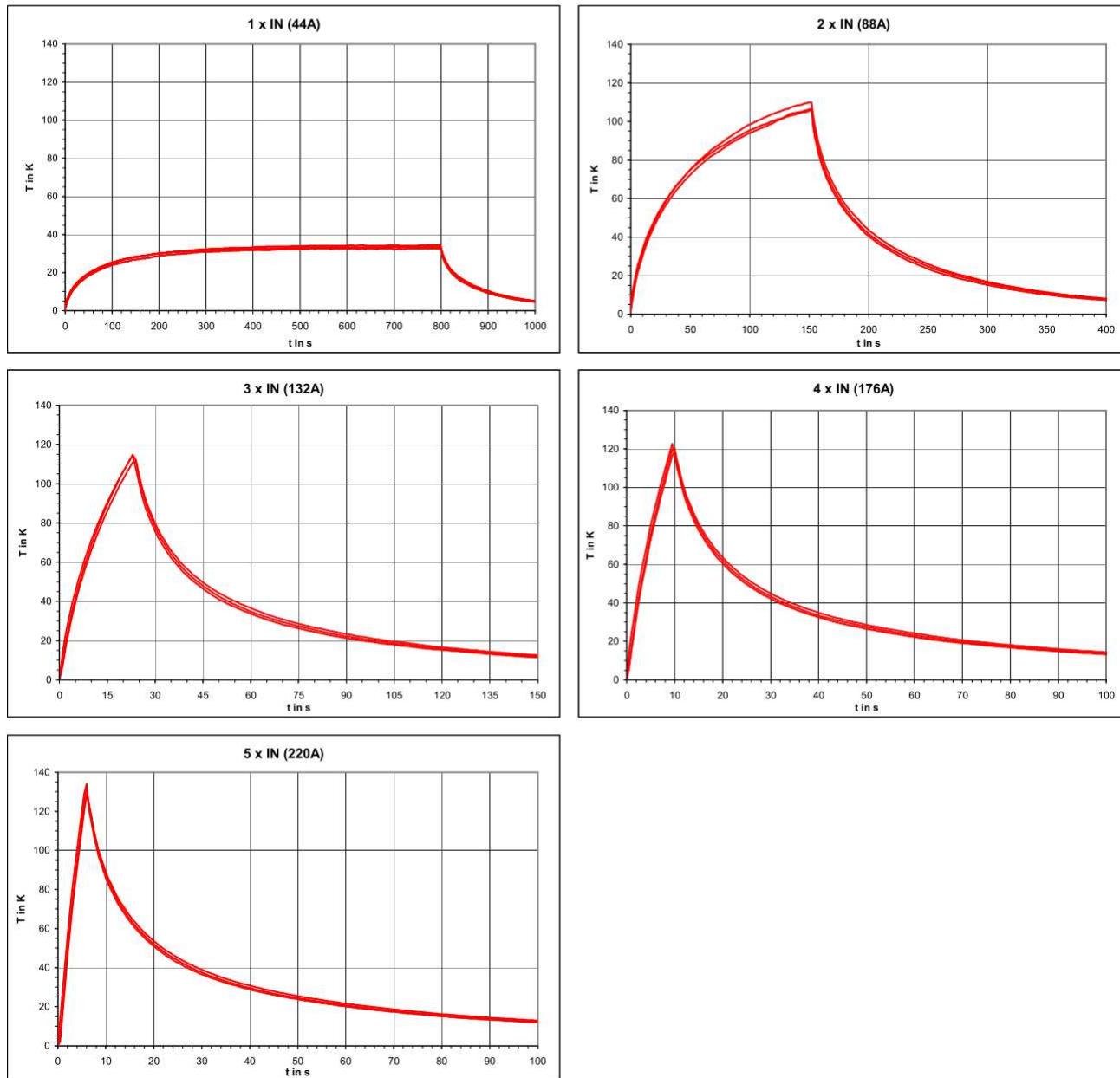


Diagram 21 / Diagramm 21

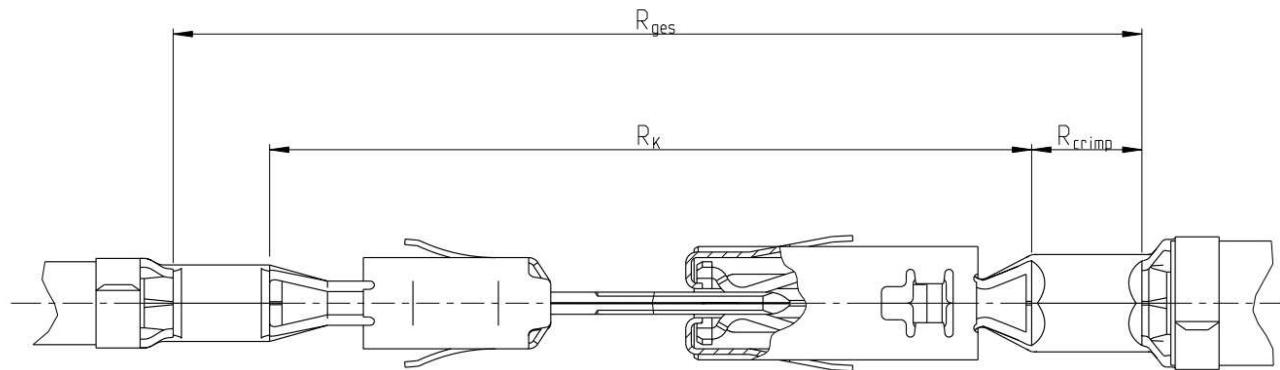
5.2. Test default
5.2 Testvorgaben


Fig. 3 / Bild 3

LTR	REVISION RECORD	DWN	APP	DATE
D	1. Scope and 2. Referenced documents, content changed; 3. Description (Contact design, Materials) added; 4. Requirements content changed; 4.3 Test requirements and procedure, new values and reference to LV214 added; 4.4 Test sequence changed; New derating curves diagram 1-18; Terminal time constant diagram 19-21 added; 5.2 Test default added;	S. BECK	S. SPEGEL C. GOEPPEL M. JOST	25MAY2016
C	Check Tab was 965849-1 and mating/unmating force change, was 7- 16, see page 14; Insertion cycles fox with Ag-Types was 10	A. MAIROSER		
B	PN 1241418 added, see table Page 10; PN 1241406 was FLK, new FLK/FLR Derating curves page 16 added	R. LIEBING		05JUL2007